

Udział i przewodniczenie komitetom naukowym konferencji, redakcje czasopism, recenzje publikacji

1. Organizacja konferencji oraz członkostwo i przewodniczenie komitetom naukowym z zakresu deklarowanej działalności naukowej

1. Członek Komitetu Naukowego oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Niemieckiego Sympozjum nt. „Nowoczesne przyrządy i systemy pomiarowe”, (Kraków 1993), otwarcie laboratorium pomiarowego w Politechnice Krakowskiej.
2. Członek Komitetu Naukowego i wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego międzynarodowego sympozjum nt. „Systemy zapewnienia jakości w budowie maszyn”, organizowanego przez Politechnikę Krakowską (Kraków 1994).
3. Członek Komitetu Naukowego Krajowej i Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – *Metrologia w Technikach Wytwarzania*, organizowanej co dwa lata w okresie 2001 – 2020, przewodnictwo sekcji oraz obrad plenarnych.
4. Jeden z pomysłodawców w 1994 oraz od początku Członek Komitetu Naukowego, a od 2008 **Przewodniczący Komitetu Naukowego**, cyklicznie co dwa lata organizowanej przez ATH w Bielsku-Białej od 1994 International Scientific Conference - Coordinate Measurement Technique. Przewodnictwo obrad plenarnych, wielokrotne wykłady plenarne.
5. Członek Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej: *Innowacje i Transfer Technologii w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach – Inteltrans*, organizowanej przez Politechnikę Krakowską od 1998 do 2006.
6. Członek Komitetu Programowego Seminarium *Innowacje i Transfer Technologii jako Czynniki Stymulujące Rozwój Gospodarczy*, organizowanego przez Politechnikę Krakowską w latach 2000, 2002, 2004, 2006.
7. Sekretarz Komitetu Naukowego *X Krajowej i I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej – Metrologia w Technikach Wytwarzania*, Kraków 2003.
8. Członek Komitetu Organizacyjnego - *CIRP General Assembly*, Kraków, 2004
9. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego 10th IMEKO TC14 ISMQC Symposium on Measurement and Quality Control, Osaka, Japonia, 2010.
10. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego 11th IMEKO TC14 International Symposium on Measurement and Quality Control (ISMQC 2013), Kraków – Kielce.
11. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego 12th IMEKO TC14 ISMQC Symposium on Measurement and Quality Control, Belgrad, Serbia 2019,
12. Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING, Poznań, 2014 i 2017.
13. IMEKO International Measurement Confederation – (2000 Wiena, 2003 Dubrownik, 2006 Rio de Janeiro, 2009 Lisbon, 2012 Praha, 2015 Busan, 2018 Belfast). Członek Międzynarodowych Komitetów Naukowych Kongresów Światowych. Wielokrotne przewodnictwo obrad plenarnych oraz w sekcjach.

14. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit od 2017 – prestiżowego, corocznego międzynarodowego kongresu w Krakowie, którego pomysłodawcą był prof. Jerzy Hausner.

2. Stałe recenzje artykułów dla czasopism naukowych z listy JCR:

1. MEASUREMENTS - Elsevier - IF - 2,746 **obecnie 200 pkt.** wg MNIŚzW
2. METROLOGY AND MEASUREMENTS SYSTEMS – de Gruyter IF – 1.149
3. MAPAN – Springer - Journal of Metrology Society of India - IF -.1.168
4. SENSORS – MDPI -IF 3.302
5. MATERIALS – MDPI – IF 3,532
6. PRECISIONS ENGINEERING – IF 2.685

3. Recenzje wydawnicze książek naukowych i monografii,

1. Recenzja wydawnicza książki naukowej Eugeniusza Ratajczyka: Współrzędnościowa Technika Pomiarowa - Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005.
2. Recenzja wydawnicza monografii Adama Woźniaka: Dokładność głowic stykowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010.
3. Recenzja wydawnicza monografii Pawła Swornowskiego: Możliwości poprawy niepewności pomiaru zarysu okrągłości współrzędnościową techniką pomiarową. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
4. Recenzja wydawnicza książki naukowej Michała Wieczorowskiego: Metrologia nierówności powierzchni – metody i systemy, 2013. Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin, 2014. ISBN 978-83-7518-570-6.
5. Recenzja Wydawnicza Książki E. Ratajczyk A. Woźniak: Współrzędnościowe systemy pomiarowe. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016.